## 信州大学

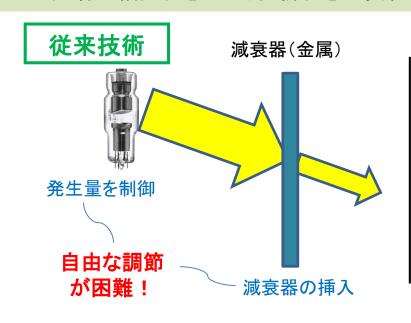
## X線の強度を自由に変える技術

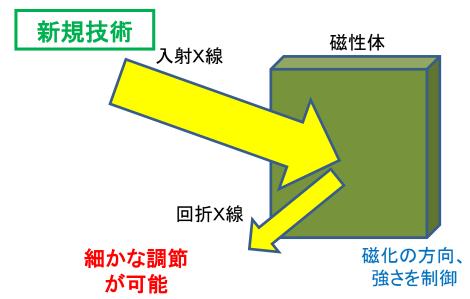
計測

全学教育機構 基幹教育センター 安達 弘通 准教授

関連特許:「X線強度変調法及びX線偏光状態分析法」(特願2014-167309)

X線を磁性体にあてることより、回折現象がおこり、強度を変化させることができます。 また、X線の偏光状態により回折状態が変わるので、偏光状態を分析にも使えます。





<偏光分析も可能>

対象となるX線を磁性体に入射し、回折X線の強度変化を測定磁化の方向・強度による理論予測値や較正データと比較

⇒ 偏光状態を知る

★X線を使った製造装置(リソグラフィ)、検査機器、分析機器の開発に!